# ⑱日本国特許庁(JP)

10 特許出願公告

❷❸公告 昭和60年(1985)6月20日

# <sup>(3)</sup>特 許 公 報(B2)

昭60-25917

®Int.Cl.⁴ H 05 K 1/16 C 22 C 19/07

識別記号

6370-5F 7821-4K

H 01 C 17/14

6411-4K 7303-5E

庁内整理番号

発明の数 1 (全12頁)

❷発明の名称 プリン

プリント回路板

前置審査に係属中

②特 顧 昭49-85269

❷公 閉 昭50-71513

❷出 願 昭49(1974) 7月26日

外1名

❷昭50(1975)6月13日

優先権主張

❷1973年7月27日❷米園(US)愈383088

砂発明 者

リチヤード ノーマン

アメリカ合衆国カリフオルニア州ロサンジェルス、センテ

カストンゲイ 出 願 人 ザ・マイカ・コー イネラブールパード 3771

の出 願 人 ザ・マイカ・コーポレ イション

アメリカ合衆国カリフオルニア州カルバーシテイ, エレンダストリート4031

四代 理 人 弁理士 倉内 基弘

審 査 官 磐参考文献

平 沢 伸幸

特開 昭49-89856 (JP, A)

特别 昭46-3375 (JP, A)

特公 昭57-3234 (JP, B2)

実公 昭42-3717 (JP, Y1)

1

2

# 砂特許請求の範囲

1 絶縁支持体と、該支持体に付着される電気抵抗材料からなる少く共一層と、そして該抵抗材料にそれと近密に接触した状態で付着される高電導性材料の層とから成り、該電気抵抗材料層が、重 5 量%で表わして、

- (1) 13~74%アンチモンを含むクロムーアンチモン、
- (2) 10~80%マンガンを含むクロムーマンガン、
- (3) 6~52%燐を含むクロムー燐、
- (4) 14~65%セレンを含むクロムーセレン、
- (5) 21~75%テルルを含むクロムーテルル、
- (6) 18~72%アンチモンを含むコバルトーアンチ モン、
- (7) 2~36%硼素を含むコバルトー硼素、
- (8) 6~60%ゲルマニウムを含むコパルトーゲル マニウム、
- (9) 18~71%インジウムを含むコバルトーインジウム、
- 40 10~65%モリブデンを含むコバルトーモリブ 20 デン、
- (11) 6~52%燐を含むコバルトー燐、
- (12). 25~95%レニウムを含むコバルトーレニウ

4,

- (13) 16~94%ルテニウムを含むコバルトールテニウム、
- (14) 15~72%タングステンを含むコバルトータ ングステン、
- (15) 9~70%パナジウムを含むコバルトーパナジウム、
- (16) 9~65%パナジウムを含む鉄ーパナジウム、
- 10 (17) 15~74%アンチモンを含むニッケルーアン チモン、
  - (18) 2~36%硼素を含むニッケルー硼素、
  - (19) 6~60%ゲルマウムを含むニッケルーゲルマニウム、
- 15 (20) 18~71%インジウムを含むニツケルーイン ジウム、
  - (21) 10~65%モリブデンを含むニッケルーモリブデン、
  - (22) 75~95%レニウムを含むニッケルーレニウ
  - (23) 9~72%バナジウムを含むニツケルーバナ ジウム、

及び、

(24) 9~40%モリブデンを含むパラジウムーモ リブデン

から成る群から選択される合金の電気めつき層で あることを特徴とする成層原板の形態をなしたプ リント回路板。

#### 発明の詳細な説明

## 発明の分野

本発明は、成層プリント回路板に関するもので あり、特には特定の2元合金群から選択された電 気めつき抵抗材料圏を一体に含むプリント回路板 10 00 10~65%モリブデンを含むコバルトーモリブ に関する。詳しくは、本発明は、絶縁性の支持 体、一つないしそれ以上の闇の抵抗材料及び一層 ないし二層の、高電導性材料からなる成層原板の 形態をなしたプリント回路板と関係する。 電導性 素子だけでなく電気抵抗性の素子をも備えた印刷 15 (13) 16~94%ルテニウムを含むコバルトールテ 回路がこの回路板から作製しうる。回路板を所望 のプリント回路製品に変える方法は、所要の電気 的性質、即ち絶縁性帯域(支持体上方の層のすべ てが除去されている)、抵抗性帯域(電源性層が 除去されている)、及び電導性帯域(除去層な 20 し)の所望の配列模様を残すよう所望されざる層 を選択的に除去することから成る。

#### 発明の背景

上述したような3種の層即ち、絶縁層、抵抗層 及び電導層を具備する成層回路板は、所望の領域 25 (18) 2~36%研集を含むニッケルー研索、 を選択的に蹊星させることにより所望のブリント 回路を容易に製造ならしめる点で有益である。し かし、従来用いられた抵抗層は、圧着法、蒸着法 により形成されたものが多く、その電気的特性、 支持体への耐剝離性等の点から必ずしも満足のい 30 (21) 10~65%モリブデンを含むニッケルーモリ くものでなかつた。

本発明者は満足すべき抵抗材料を求めて検討を 重ねた結果、以下に示す特定の合金群から選択さ れた電気めつき層が良好な抵抗値、支持体へ強固 に付着した連続膜の形成能等の抵抗材料層として 35 要求される諸性質の観点からきわめて優れている ことを見出した。

#### 発明の概要

本発明において使用される抵抗材料層は、重量 %で表わして、

- (1) 13~74%アンチモンを含むクロムーアンチモ
- (2) 10~80%マンガンを含むクロムーマンガン、
- (3) 6~52%燐を含むクロムー燐、

- (4) 14~65%セレンを含むクロムーセレン、
- (5) 21~75%テルルを含むクロムーテルル、
- (6) 18~72%アンチモンを含むコバルトーアンチ モン、
- 5 (7) 2~36%研索を含むコバルトー研索、
  - (8) 6~60%ゲルマニウムを含むコパルトーゲル マニウム、
  - (9) 18~71%インジウムを含むコバルトーインジ ウム、
- デン、
  - (11) 6~52%燐を含むコバルトー燐、
  - (12) 25~95%レニウムを含むコバルトーレニウ
- ニウム、
  - (14) 15~72%タングステンを含むコバルトータ ングステン、
- (15) 9~70%パナジウムを含むコパルトーパナ ジウム、
- (16) 9~65%バナジウムを含む鉄ーバナジウ ٨,
- (17) 15~74%アンチモンを含むニツケルーアン チモン、
- - (19) 6~60%ゲルマニウムを含むニツケルーゲ ルマニウム、
  - (20) 18~71%インジウムを含むニッケルーイン ジウム、
- - (22) 75~95%レニウムを含むニッケルーレニウ
  - (23) 9~72%パナジウムを含むニツケルーパナ ジウム、 及び、
  - (24) 9~40%モリブデンを含むパラジウムーモ リブデン、

から成る群から選択される合金の電気めつき層で 40 ある。

本発明の抵抗材料は二元合金である、即ちこれ らは固溶体、純金属、金属間化合物、及び(或い は)その混合物の形をなしているであろう2つの 化学元素を含んでいる。これらの抵抗材料は、一

般に100μΩーσσの最小バルク抵抗を持つてお り、物理的な完全性を失うことなく絶縁性支持体 への結合に耐えうる密着性付着物を再現性をもつ てもたらすべく水溶液から電気めつきにより容易 えあるとしても400℃以上の温度での結晶学的相 変態と融点しか持つておらず、適正に付着された なら-65~+125℃の範囲で±300m以下の抵抗の 温度係数を持つものであり、2.89×10™モル/ cd/秒以下のα相鋼中への拡散係数を持つてお 10 を含む写真原板を通して露光される。露光フォト り、現在入手しうる抵抗体の代表的な電流対電圧 特性を持つものであり、そして不働態化、陽極酸 化、重ね被覆、或いは無機乃至有機層によるコー テイングにより適当に保護される時通常の使用条 抗材料層として要求される諸性質を兼備する。 本発明の具体的説明

抵抗材料は浴から銅のような電導性箔上に付着 される。幾つかの場合、抵抗性皮膜における性質 いて空気中で或いは制御された雰囲気中で高温下 で複層箔を加熱することによりもたらされよう。 その後、復層箔は、抵抗体側を適当な硬化性有機 樹脂調合剤を予備的に含浸せしめた繊維ガラス織 物の一つないしそれ以上の層で成層される。この 25 リン アンド フィルム社によるPR-102)。絹 成層構造体中に高い熱伝導性材料の層を含めるこ とがしばしば所望される。その目的は、成層体表 面上に形成される抵抗体の電気的な発熱作用の緩 和の為の熱伝達機構を与えることである。アルミ を見出した。熱電導層は、抵抗性上被体の反対側 面に積層されてもよくまた予備含浸された補強体 の数層中に含まれてもよい。成層方法は当業者に 良く知られている。幾つかの場合、抵抗性皮膜の 性質における変化は工程のこの点において昇温下 35 -65℃~+125℃の温度範囲にわたつて生じる変 で成層体を加熱することによりもたらされよう。 これらの段階に続いて、そしてプリント回路製作 に使用される時点において、銅表面はフォトレジ スト層で被覆される。その後、このフォトレジス ト層は抵抗体及び電導体組合せ模様の反転像を含 40 む写真原板を通して露光される。フォトレジスト 層に露光模様が発現されそして非露光部分は洗い 除かれる。その後、発現した像模様を持つたパネ ルは、露出した銅が除かれるまで塩酸で酸性化し

た塩化第二鉄或いはアルカリ性エツチング剤のよ うなエツチング剤中でエツチングされる。その 後、パネルは水中で洗われそして露出している抵 抗性材料が除かれるまでその特定の合金に適した に形成できるものであり、非放射性であり、たと 5 エツチング液中に浸漬される。別様には、抵抗性 層は粉末状みがき粉のような物質を使用しての研 磨により除去されよう。残存した露星フォトレジ スト部は剝され、そしてパネルは新しいフォトレ ジスト層で覆われる。この層は導体模様の反転像 レジスト層模様が発現されそして非露光部分は洗 い落される。この発現像模様を持つパネルは露早 銅が除去されるまで適当なエッチング剤中でエッ チングされる。その後、パネルは水中で洗われそ 件に耐えるに充分の化学的耐性を持つもの点で抵 15 して乾燥される。この時点で、電導性及び抵抗性 模様が互いに適当な電気的接触をなして個々に頭 成される。

ここで述べた一般的方法及び以下に挙げる具体 例に述べる方法は写真陰画原板及び陰画原板と協 の所望される変化は、工程におけるこの時点にお 20 働して働くレジストの使用を意図するものであ る。プリント回路製造業者に良く知られている他 の処理材料もまた適当なものであることを銘記さ れたい。例えば写真陽画原板も陽画原板用レジス トと組合せて使用できる(例えばゼネラル アニ スクリーン技術もまたエツチング剤により侵食さ れない任意のレジストと組合せて使用されうる。

以下の説明において組成範囲はすべて重量%で **表わしてある。抵抗率はμΩーα単位で与えられ** ニウム及び銅箔がこの目的の為に適当であること 30 ている。掲げた最初の値は最初の組成値における 抵抗である。次に記載してある抵抗値は指定組成 範囲内で到達しうる最大値であり、この抵抗値は 組成限界値において起るとは限らない。TCR は、単位℃当りの両単位で与えられておりそして 化を反映する。適当なガラス繊維補強基板に結着 された然るべき電着処理された合金皮膜に対して は、与えられるTCR値の範囲は合金の組成が記 載される範囲内にあるなら観察される値の範囲を 一般に包括している。しかし、幾つかの場合に は、この呈示TCR値範囲外の値が非常に限定さ れた組成範囲に対して観察されることがある。 TCR値の限界値は最大組成値と最小組成値と一 致しないことがしばしばある。

電導皮膜の広帯域にわたつて付着される、再現性のある、一様な、細粒の薄い合金皮膜は、本発明の実際的使用に必須である。従来技術において使用できる様々な被覆浴のうちで、指定される全組成範囲にわたつて上述した特性を具備した皮膜 5 を生成するにはごくわずかの浴のみが適当であり、完全な抵抗体生産ラインを確立する為にはある要件が必要である。一つの合金組成を使用して得られる抵抗体の範囲はこれら実際的用途に対して充分ではない。好ましい浴は次の例に述べられ 10 ている。

全組成範囲の合金を生成するのに必要な金属、 鎧体、塩及び添加剤濃度の範囲が呈示されてい る。金属及び錯体濃度間並びに金属、添加剤及び 錯体濃度間の相互関係は、付着層に異つた合金組 15 成を発現するために金属濃度が変えられる時錯 体、塩及び添加剤浸度に必要とされる変化につい てのように、当業者には良く知らている。好まし い温度は浴のすべての成分を溶解状態にとどまら せるような呈示範囲の最低温度である。好ましい 20 PH値は指示範囲の平均値である。好ましい形態の 電気エネルギーは、別様に但し書がなければ電圧 及び電流制御直流である。好ましい電流密度は、 所望される合金組成物に依存しそして与えられる 他の情報の制約の下で当業者には明らかである。25 **攪拌がすべての浴において使用される。不溶性の** アノードが好ましいが、二元合金乃至そのいずれ かの金属からなる可溶性のアノードも適当であ る。浴の操作に必要な添加剤が示されているが、 電気めつきにおいて一般に使用されるような添加 30 剤が幾つかの系に対して最適の結果を得るために 有用であろう。

記載されているもの以外の或いはそれに加えて、浴中の金属の両者乃至片方に対してのくえん酸塩、酒石酸塩、蓚酸塩、マレイン酸塩、マロン 35酸塩、グリコレート、ピロりん酸塩、アンモニア、及び硼酸のような錯化剤が多くの場合適当でありそして当業者に明らかであろう。

次のような表示、即ち金属イオン(アニオン)が使用される場合、与えられる重量は金属のみに 40 対するものでありそして示されるカチオン及びアニオンは金属を浴中に導入するための好ましい種である。与えられる重量が水和物を示す場合には、水和物が所定の化学式において明示される。

以下の例は本発明を例示する為だけに示される のであつて何等限定を意図するものではない。

#### 例 1

系 : クロムーアンチモン 組 成:13~74%アンチモン 抵抗率:74~526μΩーcm TCR:+100~+500mm/℃

めつき技術

(i) 三酸化クロムCrO。 100~300g/1 アンチモン酸カリウムK<sub>8</sub>SbO<sub>4</sub>

13~1300g/ J 硫 酸H<sub>a</sub>SO。 0~500g/ 1 電流密度 5~50A/dm<sup>2</sup> 温 度 20~90℃ 門 酸 性 浴中のアンチモン含量を4%から90%まで変 えることにより、付着物中のアモン含量は13% から74%まで変わる。

- (ii) K<sub>s</sub>SbO<sub>4</sub>を除いてそしてSb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>を16~1600g/ 1加えたことを除いて(j)と同様である。浴中の アンチモン含量を4%から90%まで変えること により、付着物中のアンチモン含量は13~74% の範囲で変えられる。
- (ii) クロム (フルオ硼酸塩) Cr<sup>+3</sup> (BF<sub>4</sub><sup>-</sup>)

2.6-78g/1

アンチモン (フルオ硼酸塩) Sb+3 (BF-4)

6.1 - 183g / 1

フルオ硼酸 (遊離) HBF。 150-650g/1 硼 酸HaBO。 0-50g/1 電流密度 1-25A/dm² 温 度 20-80℃

PH Reft

浴中のアンチモン含量を7.25%から98%まで変えることにより、付着物アンチモン含量は13%から74%まで変えられる。幾つかの場合、非晶質付着物を得るためには、添加剤が浴中で使用されねばならない。それらの正確な性質は、使用中の浴組成及び付着用基板に依存する。

**91** 2

系 : クロムーマンガン 組 成:10~80%マンガン 抵抗率:36~194μΩーσα TCR:+150~+50mm/℃ めつき技術

9	
(i) 三酸化クロムCrO <sub>3</sub>	100~300g/1
過マンガン酸カリウムKMnO。	8~800g/1
硫 酸H。SO。	0~5009/1
電流密度	5~50A/dm <sup>2</sup>
温度	20~90°C
р <del>Н</del>	酸性
浴中のマンガン含量を1.75%が	ゅら80%まで変
えることにより、付着物中のマ:	ノガン含量は10
%から80%まで変えられる。	
(ii) クロムアンモニウムスルフエー	- <b>ト</b>
$(NH_{4})$ Cr $(SO_{4})_{2} \cdot 12H_{2}O$	500~700g/1
硫酸マンガンMnSO4	5~100g/1
硫酸マグネシウムMgSO₄	30~70g/1
硫安(NH,)2SO4	40~80g/I
少酸ルマンミュム / NIU AU	10 00 4

水酸化アンモニウムNH、OH 電流密度 5~50A/dm² 温度 20~90°C PΗ アルカリ性 浴中のマンガン含量を2.5%から40%に変え ることにより、付着物中のマンガン含量は10% 20

から50%まで変えられる。

**971** 3

杀 :クロムー燐

組 成:6-52% 嬌

抵抗率:57~162µΩ-cm

 $TCR: -75\sim +50pm/^{\circ}C$ 

めつき技術

(j) 三酸化クロムCrOa 100~300g/1 燐 酸H。PO。  $4 \sim 400g / 1$ 疏 酸HeSO. 0~98g/1 30 電流密度 5~50A/dm2

温度

20~90°C

PΗ

酸性

(ji) H<sub>3</sub>PO<sub>2</sub>を排除しそしてH<sub>8</sub>PO<sub>4</sub>を5~500 (250) g/1加えたことを除いて(i)と同じであ 35

る。

(i)及び(ii)における燐含量を1%から73%に変え ることにより、付着物中の燐含量は6%から52% まで変えられる。

例 4

派 :クロムーセレン 組 成:14~65%セレン 抵抗率:80~2300μΩ-cm TCR: +100~+800pm/℃ めつき技術

三酸化クロムCrO。 100~300g/1 セレン酸HzSeOa 7.25~725g/1 硫酸H<sub>2</sub>SO. 0~98g/1 電流密度 5~50A/dm² 温度 20~90°C PH 酸件

浴中のセレン含量を2.5%から88%に変えるこ とにより、付着物中のセレン含量は14%から65%

10 まで変えられる。

例 5

系 : クロムーテルル

組 成:21~75%テルル

抵抗率:92~420μΩ-cm

40~80g/1 15 TCR:+100~+500pm/°C

めつき技術

(i) 三酸化クロムCrO。 100~300g/1 三酸化テルルTeO。 9~8808/1 敬 酸H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  $0 \sim 500 g / 1$ 電流密度 5~50A/dm² 温度 20~90°C PH 酸性

浴中のテルル含量を4%から95%に変えるこ とにより、付着物中のテルル含21%から75%ま

で変えられる。

(ji) TeOsを排除しそしてHeTeOsを11~1100g/ 1加えたことをいて(i)と同じ。

浴中のテルル含量を4%から95%まで変える ことにより、付着物中のテルル含量は21%から

75%まで変えられる。

**671** 6

系 : コバルトーアンチモン

組 成:18~72%アンチモン

抵抗率:65~2000μΩ-cm

TCR: +100~+800pm/°C

めつき技術

(j) コパルト (フルオ硼酸塩) Co+2 (BF<sub>4</sub>-)

3~90g∕ı

アンチモン(フルオ硼酸塩) Sb\*\* (BF,-)

60~180g/1

フルオ研酸HBF。 150~650g/1 研 酸H,BO,  $0 \sim 50g/1$ 電流密度  $1-25A/dm^2$ 

溫 度

20~80°C

40

酸性 PH 浴中のアンチモン含量を7%から99%まで変 えることにより、付着物中のアンチモン含量は 18%から72%まで変えられる。

(ji) 酒石酸アンチモニルカリウムKSbC,H,O,

50~1000g/1

コパルト (硫酸塩) Co\*2 (SO<sub>4</sub>-2)

 $6 \sim 60g / 1$ 

ロツシェル塩KNaC。H。O。

30~300g/1

電流密度

1~25A/dm² 10

温度

20~80°C

別(アンモニア添加による)

8~11

浴中のアンチモン含量を23%から98%に変え ることにより、付着物中のアンチモン含量は18 %から72%に変えられる。幾つかの場合、非結 15 晶性付着物を得る為には、浴中に添加剤が使用 されねばならない。それらの正確な性質は使用 される浴組成と付着用基板に依存する。

**67**1 7

系 :コパルトー硼素

組 成:2~36%硼素

抵抗率:36~108µΩ-cm

TCR: -75~+50pm/℃

めつき技術

(j) 水素化硼素ナトリウムNaBH。  $4 \sim 40 g / 1 25$ コパルト (塩化物) Co+2 (CI-) 5~15g/1 水酸化アンモニウムNH、OH 150~225g/1 電流密度 1~15A/dm2

温度

20~60°C

PΗ

11~12.5 30

浴中の翻案含量を7%から70%まで変えるこ とにより、付着物中の硼素含量は2%から36% まで変えられる。

(ii) ジメチルアミンボラン (CH<sub>a</sub>)<sub>a</sub>NHBH<sub>a</sub>

5~100g/1 35

マロン酸ナトリウムCH2 (COONa)2

40~130g/1

コパルト (硫酸塩) Co+g (SO₄-g)

11~38g/1

1~20A/dm² 40 電流密度

20~80°C 温度

PH(アンモニア添加による) 5~5.6

浴中の硼素含量を3%から68%まで変えるこ とにより、付着物中の硼素含量%から36%まで 12

変えられる。(j)及び(jj)において、コバルト及び 婚化剤は硼素含有化合物が浴に付加される前に 充分に混合さるべきである。

**671** 8

蒸 :コバルトーゲルマニウム

組 成:6~60%ゲルマニウム

抵抗率: 34~321μΩ-cm

TCR: +100~-50mm/℃

めつき技術

ゲルマニウム (酸化物) GeO<sub>s</sub> 0.15~15.0g/1 コパルト (塩化物) Co+3 (CI+) 0.1~10.0g/1

塩化アンモニウムNH。CI 25~30g/1

薔酸アンモニウム (NH,)₂C₂O。  $30 \sim 40 g / 1$ 

ピロ亜硫酸ナトリウムNa<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub>  $1 \sim 5g/J$ 

電流密度 2~10A/dm2

温度 20~50°C

PΗ アルカリ性

浴中のケルマニウム含量を5%から90%まで変 えるとにより、付着物中のゲルマニウム含量は6

20 %から60%まで変えられる。

**67** 9

系 : コバルトーインジウム

組 成:18~71%インジウム

抵抗率:65~335µΩ-cm

TCR: +100~-50mm/℃

めつき技術

(i) インジウム(硫酸塩)In+3 (SO<sub>4</sub>-2)

15~30g/ J

コパルト (硫酸塩) Co+2 (SO<sub>4</sub>-2)

11~30g/1

電流密度 2~12A/dm²

温度 20~70°C

Hq  $1 \sim 3$ 

俗中のコバルト及びインジウム濃度並びに電 流密度を変えることにより、付着のインジウム は60%から70%まで変えられる。

(ji) インジウム (硫酸塩) lif<sup>+3</sup> (SO<sub>4</sub>-2)

0.3~8g/1

コバルト (硫酸塩) Co+2 (SO4-2)

30~100g/1

スルフアミン酸H。N・SOaH 50g/1

電流密度  $2 \sim 10A / dm^2$ 温度 20~70°C

PH  $1 \sim 3$ 

浴中のインジウムの重量が0.3g/lから 100g/1まで増加される際、物中のインジウ ムは18%から71%まで増大する。

例 10

系 :コバルトーモリブデン

組 成:10~65%モリブデン

抵抗率:57~292µΩ-cm  $TCR: +300 \sim +100 \pi / ^{\circ}C$ 

めつき技術

(j) モリブデン酸ナトリウムNa2MoO4・2H2O

 $5 \sim 17g/1$ 

コバルト (炭酸塩) Co+2 (CO<sub>2</sub>-2) 10g/1

炭酸カリウムK<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

650g/ }

電流密度

5~20A/dm\*

温 度

25~100°C 15

PΗ

10.5~11.5

20

浴中のモリブデン含量を30%から85%まで変 えることにより、付着物中のモリブデン合量は 15%から35%まで変えられる。

(ji) モリブデン酸ナトリウムNaMoO.・2H。O

30~40g/1

コバルト (炭酸塩) Co-2 (CO<sub>3</sub>-3)

 $2 \sim 5g / 1$ 

75~85g/1 重 曹NaHCO 60~80g/1 25 ピロ燐酸ナトリウムNa,PgOr

硫酸ヒドラジン2N2H,・H2SO, 1~3g/I

電流密度 温 度

5~20A/dm²

20~75°C 7.5~9

PH 硫酸ヒドラジンはこの浴において代表的に使 30

用される不活性アノードにおけるされざる反応 を防止する。浴中のモリブデン含量を70%から 90%までに変えることにより、付着物中のモリ ブデン含量は45%から55%まで変えられる。

(ii) モリブデン酸ナトリウムNaMoO4・2HgO 35

 $3 \sim 50g / 1$ 

コパルト (硫酸塩) Co+2 (SO,-2)

6~50g/1

くえん酸ナトリウム (NaOOC)。CaH4OH

30-300g/1 40

電流密度

 $1-20A/dm^2$ 

温度

25-70°C

PH (アンモニア成いは硫酸の添加による)

3~5或いは9-12

14

この浴は酸性或いはアルカリ性の凹値におい て使用されうる。中間範囲においは電流効率は 所望されざる程に低い。付着物中のモリブデン 含量は、浴中のモリブデン含量を3%から77% まで変えることにより10%から65%まで変えら 師の浴に関して、幾つかの場合、モリ れる。 ブデン酸ナトリウムとくえん酸ナトリウムを浴に 添加する前にそれらを溶解状態で組合せることが 有益である。これらの成分は、平衡状態が確立さ 10 れるまでそして生じた錯体がめつき浴に添加され るさまで反応せしめられる。

例 11

茶 :コパルトー燐

組 成:6~52%燐

抵抗率:45~138µΩ-cm

TCR: -75~+50pm/℃

めつき技術

(j) コバルト (炭酸塩) Co+2 (CO<sub>3</sub>-2)

5~100g/1

亚烯酸H。PO4  $2 \sim 160 g / 1$ 

4 ~40A /dm2 電流密度

65~95°C

温度  $0.5 \sim 1$ PΗ

浴中の燐含量を1%から54%まで変えること により、付着物中の燐含量は6%から52%まで 変えられる。

(ji) コバルト (塩化物) Co+2 (Cl-) 20~100g/1

燐酸H₀PO。 10~100g/J

亚燐酸H。PO。  $2 \sim 100 g / 1$ 

コバルト (炭酸塩) Co+2 (CO,-2)

 $5 \sim 15g / 1$ 

電流密度  $4 \sim 40g / 1$ 

温度 65~95℃

 $0.5 \sim 1$ 

浴中の利用しうる燐含量(亜燐酸として浴中 に存在)を変えることにより、付着物中の燐含 量は6~52%まで変えられよう。(i)及び(ji)の浴 に関して、これらの浴からの付着物の品質及び 電気特性は電気めつきにおいて使用される直流 と併せて交流を賦果することにより改善されう る。AC:DCの比率は2/1から5/1まで変 えられよう。

1891 12

( 系 :コバルトーレニウム

組 成:25~95%レニウム 抵抗率: 135~438μΩ-cm TCR: +300~+100pm/℃

めつき技術

過レニウム酸カリウムKReO。 1 - 150g / 1 5コパルト (硫酸塩) Co+2 (SO<sub>4</sub>-2) 2-25g/1 くえん酸HOCaH。(COOH)。 20-200g/1電流密度 2~12A/dm3

温度

25~90℃

PH(アンモニア或いは硫酸の添加による)

 $3 \sim 8$ 

15

20

浴中のレニウム含量を3%から80%まで変える とにより、付着物中のレニウム含量は25%から95 %まで変えられる。

例 13

系 : コバルトールテニウム 組 成:16~94%ルテニウム 抵抗率: 245~680μΩ-cm TCR: +100~-50mm/°C

めつき技術

ルテニウム (塩化物) Ru+\* (C)-)

 $0.1 \sim 50 g / 1$ コバルト (塩化物) Co+2 (CI-)  $2 \sim 50 g / 1$ 

塩化アンモニウムNH、CI

50~120g/1  $3 \sim 5g / 1 25$ 

塩化カリウムKCI 過酸化水素H<sub>2</sub>O。

 $1 \sim 2g/1$ 

電流密度

4~10A/dm8

温度

20~50°C

PH (HCIの添加による)

1 - 3

浴中のルテニウム含量を0.5%から96%まで変 30 えることにより、付着物中のルテニウム含量は16 %から94%まで変えられる。

**67**1 14

系 : コパルトータングステン

組 成::15~72%タングステン

抵抗率:37~236μΩ-cm  $TCR: +300 \sim +100 \text{pm} / ^{\circ}\text{C}$ 

めつき技術

(i) タングステン酸ナトリウムNagWO4・2HoO

10~100g/1 40

コバルト(硫酸塩或いは塩化物)

Co+2 (SO<sub>4</sub>-2或いはCI-)

 $0.85 \sim 40 \text{g} / 1$ 

くえん酸HOC<sub>2</sub>H<sub>4</sub> (COOH)<sub>3</sub> 20~200g/1

塩化アンモニウムNH、CI

 $0 \sim 50 g / 1$ 

16

硫酸ヒドラジニウム2N2H。・HaSO。

 $0 \sim 10 \text{g} / 1$ 

電流密度

2~20A/dm²

温度

50~90°C

PH(アンモニア添加による)

6.4~9.8 浴中のタングステン含量を12%から98%まで 変えることにより、付着物中のタングステン会

量は15%から72%まで変えられる。

(ii) タングステン酸ナトリウム Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> • 2H<sub>2</sub>O

15~40g/1

コパルト (硫酸塩) Co+2 (SO,-2)

 $2 \sim 5g / 1$ 

硫酸アンモニウム (NH、)。SO、60~330g/1 水酸化アンモニウムNH、OH 35~758/1

水酸化ナトリウムNaOH

8~128/1

電流密度 温度

 $1 \sim 40A / dm^2$ 

PΗ

20~75°C  $9 \sim 11.5$ 

浴中のタングステン含量を57%から92%まで 変えることにより、付着物中のタングステン含 量は20%から57%まで変えられる。電管におい た使用される直流に交流を重畳することにより 付着物の品質及び電気的性質を改善することが 可能である。AC対DCの比率は2/1から10/

例 15

系 👝 こコパルトーパナジウム

組:成:9~70%パナジウム

抵抗率: 48~148μΩ-cm

1まで変えられよう。

TCR: -75~+50mm/℃

めつき技術

(1) オキシ硫酸パナジウム三水塩

VOSO, • 3H<sub>8</sub>O

7~85g/1

コパルト (硫酸塩) Co+2 (SO<sub>4</sub>-2)

 $7 \sim 15 \text{ g/}1$ 

硼 酸H,BO,

25~30g/1

電流密度

1~10A/dm2

温度

18~80°C

PH

 $1 \sim 6$ 

浴中のバナジウム含量を10%から74%まで変 えることにより、付着物中のパナジウム含量は 9%から70%まで変えられる。

(ii) メクバナジウム酸カリウムNaVOa

 $5 \sim 50g / 1$ 

35

くえん酸ナトリウムHOCaH。(COONa)。

コパルト (塩化物) Co+2 (Cl-) 10-20g/1

抵抗率:50~1800μΩ-cm TCR: +100~+800mm/℃

めつき技術

次亜燐酸ナトリウムNaHaPOz 20~408/1

蓚酸ナトリウム二水塩Na<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>・2H<sub>2</sub>O

20~100g/1

50~100g/I

1 ~15A /dm<sup>8</sup> 電流密度 温度 20~80°C アルカリ性 PΗ

浴中のバナジウム含量を9%から67%まで変 10 えることにより、付着物中のバナジウム含量は 9%から70%まで変えられる。

例 16

系 :鉄ーバナジウム

組 成:9~65%バナジウム

抵抗率:40~217μΩ-cm TCR: -75~+50pm/℃

めつき技術

(j) バナジウム (塩化物) V+3 (Cl-)

5~40g/1 20 鉄 (塩化物) Fe+3 (C)-) 15~25g/1 塩酸或いは硫酸HCI, HgSO, 0.1g/1 1~15A/dm² 電流密度

温度 20~80°C PH 1.0~1.5 25

浴中のバナジウム含量を17%から70%まで変 えることにより、付着物中のパナジウム含量は 9%から65%まで変えられる。

(ii) メタバナジウム酸ナトリウムNaVO。

5~20g/1 30

鉄 (弗化物) Fe+2 (F-) 6.6g / 1鉄(塩化物) Fe+8 (Cl-) 0.21g / 1酢酸ナトリウムNaOOCCH。 10g/1 過燐酸ナトリウムNaHaPOa 10g/1

蓚酸カリウムー水塩K<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O・H<sub>2</sub>O 50g/1 35

電流密度 1~15A/dm²

温 度 75~90°C  $4 \sim 6$ PH

浴中のバナジウム含量を27%から54%まで変 えることにより付着物中のパナジウム含量は20 40 %から50%まで変えられる。

例 17

:ニッケルーアンチモン 組 成:15~74%アンチモン

(i) ニッケル (弗化硼素酸塩) Ni<sup>+2</sup> (BF<sub>-</sub><sup>-</sup>)

2.95~88.5g/1

アンチモン(弗化硼素酸塩)Sb\*3 (BF<sub>4</sub>-)

18

6.1~183g/1

弗化硼酸(遊離)HBF。 150~650g/1 硼酸H<sub>a</sub>BO<sub>3</sub> 0~50g/.1 電流密度 1~25A/dm2 温度 20~80°C PH 酸性

浴中のアンチモン含量を6.5%から98.5%ま で変えることにより、付着物中のアンチモン含 15 量は15%から74%まで変えられる。

(ii) 酒石酸アンチモニルカリウムKSbC、H、Oァ

50~1000g/1

ニツケル (硫酸塩) Ni<sup>+2</sup> (SO<sub>4</sub>-8)

 $6 \sim 60 g / 1$ 

ロツシェル塩KNaC。H。O。 30~300g/1 電流密度 . 1~25g/1

温度

20~80°C 州(アンモニア添加による)  $8 \sim 11$ 

浴中のアンチモン含量を23%から98%まで変 えることにより、付着物中のアンチモン含量は 15%から74%まで変えられる。(i)及び(ii)におけ る浴に関して、幾つかの場合、非晶質付着物を 得る為に添加剤が浴中で使用されねばならな い。それらの正確な性質は使用される浴組成と 付着物用基板に依存する。

例 18

:ニツケルー硼素 系

組 成:2~36%硼素

抵抗率: 34~100μΩ-cm

TCR: -75~+50m/℃

めつき技術

(i) 水素化硼素ナトリウムNaBH。  $4 \sim 40g / 1$ ニッケル(塩化物) Ni+3 (Cl-) 5~15g/1 水酸化アンモニウムNH、OH 150-225g/1

電流密度 1~15A/dm² 温度 20~60°C

PΗ 11~12.5

浴中の硼素含量を7%から70%まで変えるこ とにより、硼素含量は2%から36%まで変えら

```
20
  れる。
                                        ニッケル(硫酸塩)Ni+2 (SO,-2) 100g/]
 (ii) ジメチルアミンボラン (CH<sub>a</sub>)<sub>8</sub>NHBH<sub>a</sub>
                                        スルフアミン酸 (HSO3・NHg)
                                                               50g/1
                         5 \sim 100 g / 1
                                        電流密度
                                                           2~10A/dm²
    マロン酸ナトリウムCH₂ (COONa)。
                                       温度
                                                               20~70°C
                         40~130g/1 5
                                       PΗ
                                                                酸性
    ニッケル (硫酸塩) Na+2 (SO<sub>4</sub>-2)
                                       浴中のインジウムの重量が0.8g/1から
                         11~38g/1
                                      7.98/1まで増加されるにつれ、付着物中のイ
    電流密度
                        1~20A/dm²
                                      ンジウム含量は18%から60%まで増加する。
   温 度
                           20~80°C
                                    (ii) インジウム(硫酸塩)In+3 (SO<sub>4</sub>-2)
   PH(アンモニア添加による)
                            5~6.5 10
                                                           0.3~8.0g/1
   浴中の硼素含量を3%から68%まで変えるこ
                                       ニツケル(硫酸塩)Ni+2 (SO<sub>4</sub>-2) 30g/1
  とにより、付着物中の硼素含量は2%から36%
                                       翻 酸HaBOa
                                                               30g/1
  まで変えられる。
                                       電流密度
                                                           2~12A/dm2
   (j)及び(jj)の浴に関して、ニッケル化合物及び
                                       温度
                                                              20~70°C
  錯化剤は硼素含有化合物が浴に添加される前に 15
                                       pН
                                                                1 \sim 3
  完全に混合されるべきである。
                                       浴中のインジウム含量及び電流密度を変える
例 19
                                      ことにより、付着物中のインジウム含量は18%
  系
      : ニツケルーゲルマニウム
                                     から71%まで変えられる。
  組 成:6~60%ゲルマニウム
                                    卯 インジウム (硫酸塩) In+3 (SQ4-2)
  抵抗率:31~278μΩ-cm
                                 20
                                                            15~30g/1
 TCR: +100~-50mm/°C
                                       ニッケル (硫酸塩) Ni+2 (SO<sub>4</sub>-2)
めつき技術
                                                            11~27g/1
  . ゲルマニウム(酸化物)GeO。
                                       電流密度
                                                          2~12A/dm2
                      0.15~15.0g/1
                                      温度
                                                              20~70°C
   ニッケル (硫酸塩) Ni+2 (SO,-2)
                                 25
                                      PΗ
                                                               1 \sim 3
                       0.1 \sim 9.0 \text{g} / 1
                                      浴中のインジウム及びニッケルの重量を変え
   硫酸アンモニウム (NH₄)₂SO。 25~30g/1
                                     ることによりそして電流密度を変えることによ
   しゆう酸アンモニウム (NH,)gCgO
                                     り、付着物中のインジウム含量は60%から70%
                        30~40g/1
                                     まで変えられる。
   アンモニア水NHLOH
                        38~46g/1 30 69 21
   電流密度
                       2~10A/dmg
                                         : ニツケルーモリブデン
   温度
                          20~50°C
                                     組 成:10~65%モリブデン
   PΗ
                         アルカリ性
                                    抵抗率: 50~206μΩ-cm
 浴中のゲルマニウム含量を5%から80%まで変
                                    TCR: +300~+100mm/°C
えることにより、付着物中のゲルマニウム含量は 35 めつき技術
6%から60%まで変えられる。
                                   (1) モルリブデン酸ナトリウム
例 20
                                       Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> 2H<sub>2</sub>O
                                                          24~120g/1
 系
      :ニツケルーインジウム
                                      ニツケル (塩化物) Ni+2 (CI-)
 組 成:18~71%インジウム
                                                          2.5~3.5g/1
 抵抗率: 61~308μΩ-cm
                                      ピロリン酸ナトリウムNa,PgO, 25~215g/ 1
                                 40
 TCR: +100~50mm/°C
                                      重 曹NaHCO
                                                          70~100g/I
```

0.8~7.0g/1

硫酸ヒドラジンN2H,・H2SO,

電流密度

温度

 $0 \sim 4g / 1$ 

25~70°C

2~25A/dm²

めつき技術

(j) インジウム (硫酸塩) In\*3 (SO<sub>4</sub>-2)

 $8 \sim 10$ 

PΉ 浴中のモリブデン含量を70%から95%まで変 えることにより、付着物中のモリブデン含量は 10%から45%まで変えられる。

(jj) モリブデン酸ナトリウム

5~75g/1  $Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$ ニッケル (塩化物) Ni+\* (Cl-) 5~30g/1 クェン酸ナトリウムHOC2H4 (COONa)2

30~130g/1

塩化カリウムKCI

 $0 \sim 75g / 1$  10

電流密度

2~22A/dm2

温度

· 25~70°C

PH(塩酸或いはアンモニアの添加による) 3~6或いは8~11.5

この浴は酸性或いはアルカリ性門値において 15(ii) メタバナジウム酸ナトリウムNaVO。 使用されうる。中間値において、電流効率は所 望されざる程に低い。付着物中のモリブデン含 量は、浴中のモリブデン含量を6%から85%ま で変えるとにより10%から65%まで変えられ る。幾つかの場合、モリブデン酸ナトリウム及 20 びクエン酸ナトリウムを浴に加える前にそれら を溶解状態で組合せることが有益である。これ らの成分は、平衡が確立されるまで反応せしめ られそして生じた錯体はめつき浴に添加される

例 22

系 :ニツケルーレニウム

組 成:75~95%レニウム

抵抗率: 229~106µ N - cx

 $TCR: +100 \sim +300 pm / ^{\circ}C$ 

めつき技術

5~250g/1 過レニウム酸カリウムKReO。 ニッケル (硫酸塩) Ni+2 (SO<sub>4</sub>-2) 10~50g/1 ニッケル (塩化物) Ni+2 (CI-) 0~128/ℓ  $0 \sim 30 g / 1$ 硼 酸H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>

クエン酸HOC3H4 (COOH)3

20~200g/1 35 2~15A/dm\*

電流密度 温度

25~90°C

2~8

浴中のレニウム含量を6%から98%まで変え ることにより、付着物中のレニウム含量は75% *40* から95%まで変えられる。

例 23

:ニツケルーバナジウム 系

組 成:9~72%バナジウム

抵抗率: 41~122μΩ-cn  $TCR:-75\sim+50m$ /°C

めつき技術

(j) パナジルスルフェート三水化物VOSO。・

 $3H_{b}O$ 

7~85g/1

ニッケル (硫酸塩) Ni+2 (SO<sub>4</sub>-8)

7~15g/1

配 酸H<sub>a</sub>BO<sub>a</sub> 25~30g/1

電流密度 温度

1~10A/dm2

pН

18~80°C 1~6

浴中のバナジウム含量を10%から74%まで変 えることにより、付着物中のバナジウム含量は

9%から70%まで変えられる。

5~20g/1

ニッケル (硫酸塩) Ni+\* (SO<sub>4</sub>-2) 6.7g/1

酢酸ナトリウムNaOOCCHa 10g/1

. 10g/ ]

次亜燐酸ナトリウムNaH。FO2 しゆう酸カリウムK<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>・H<sub>2</sub>O

50g/1

電流密度

1~15A/dm²

温度

75~90°C

Ж  $4 \sim 6$ 

浴のバナジウム含量を24%から55%まで変え ることにより、付着物のパナジウム含量は9%

から70%まで変えられる。

例 24

:パラジウムーモリブデン 系

組 成:9~40%モリブデン

抵抗率:78~228µΩ-cm

TCR: +300~+100pm/°C

めつき技術

(i) モリブデン酸ナトリウム

Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> - 2H<sub>2</sub>O

24~120g/1

バラジウム(塩化物) Pd+2 (CI-)

4~79/8

ピロ燐酸ナトリウムNa,P2O, 25~215g/1

重 曹NaHCO。

70~100g/1  $0 \sim 4g / 1$ 

硫酸ヒドラジンNaH、・HaSO。

2~25A/dm²

電流密度 温度

25~75℃

PΗ

 $8 \sim 10$ 

浴中のモリブデン含量を58%から92%まで変 えることにより、付着物中のモリブデン含量は

9%から40%まで変えられる。

## (ii) モリブデン酸ナトリウム

Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> • 2H<sub>2</sub>O  $5 \sim 13g / 1$ バラジウム(塩化物)Pd\*2(Cl-)

4~45g/1

塩化アンモニウムNH、CI

60~200g/1 アンモニアNH。

電流密度 2~15A/dm² 温度 25~45℃

PH 浴中のモリブデン含量を2%から20%まで変 えることにより、付着物中のモリブデン合量は

## ⑪ モリブデン酸ナトリウム

9%から30%まで変化される。

Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> • 2H<sub>2</sub>O バラジウム(塩化物)Pd (Cl) 10~60g/ 1 くえん酸ナトリウムHOC<sub>3</sub>H<sub>4</sub> (COONa)<sub>3</sub>

30~130g/1

塩化カリウムKCI.

 $0 \sim 75 g / 1$ 

電流密度

温度

25~70°C

3~6 或いは8~11.5 浴中のモリブデン含量を3%から70%まで変

えることにより、付着物中のモリブデン含量は

24

9%から40%まで変えられる。

高電導層材料は好ましくは、鋼箔、錫含入銅 箔、アルミ箔、亜鉛箔或いは銀箔のような干備成 形された金属箔から成る。任意の都合のよい箔厚 20~100g/ 1 5 さが使用でき、例えば0.002 (0.051mm) である。

絶縁性支持体は当業者に知られた材料のうちい ずれでもよい。例えば、支持体は有機ジアミン及 びジカルボキシル酸ないしテトラカルボキシル酸 に基くもののようなボリイミドでありうる。有機 8~11.5 10 ポリフエノールのポリグリシジルエーテルに拡く エポキシ樹脂もまた好ましい。これらの樹脂質支 持体は繊維ガラス織物のようなよく知られた補強 材の任意のものを含むことができる。支持体はま た、フェノール樹脂含浸紙、メラミン樹脂含浸 5~57g/l 15 紙、ポリイミド樹脂含浸ガラス繊維織物或いはポ リエステル樹脂含有チョップガラス補強材を含み うるものである。成層構造体中に高熱伝導性の層 を含めることがしばしば所望される。層は抵抗体 被覆層と対向する側に成層されてもよいしまた幾 2~22A/dm² 20 つかの予備含浸補強層内に含められてもよい。熱 伝導層の目的は、成層体表面に形成された抵抗体 の電気的な加熱作用の緩和の為の熱伝達機構を提 供することである。